



Electromagnetic Compatibility Italy Chapter
Instrumentation & Measurement Italy Chapter

Con il Patrocinio dell'IEEE EMC Society, il giorno **6 Ottobre 2011** l'Ing. Giuseppe Savoia della Agilent Technologies terrà un seminario dal titolo

ORGANIZZAZIONE

Prof. Giuseppe Ferrara
Dr. Angelo Gifuni
Ing. Antonio Sorrentino
Ing. Pasquale Ruggiero

“EMI seminar:

nuove norme e nuove soluzioni per i test di Compatibilità Elettromagnetica”

link

<http://www.dit.uniparthenope.it/dit2010>

Il seminario si svolgerà presso **l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, Centro Direzionale Isola C 4, Aula Magna, piano -1 lato SUD, dalle ore 09:15 alle ore 12:30 circa.

Agenda:

Come raggiungere la Parthenope: Per chi giunge in treno, dalla stazione centrale di Napoli, prendere il treno locale della Circumvesuviana, direzione Baiano e/o Acerra, e/o C.Direzionale e/o Poggioreale. La prima stazione è quella del Centro Direzionale. Per chi giunge in auto, sulla autostrada A1 Napoli-Milano uscita C.Direzionale.

- Benvenuto dell'Ing. Pasquale Ruggiero della Microlease Italia
- Introduzione alle misure EMI
 - Terminologia;
 - Sistema di misura (antenna, LISN, ricevitore, etc.);
 - Detectors;
 - Normative europee ed internazionali
- Misure di compatibilità elettromagnetica
 - Misure di emissioni radiate
 - Misure di emissioni condotte
 - Misure di immunità (EMS)
 - Setup di misura
 - Camere anecoiche vs. OATS (Open Area Test Site)
- Soluzioni di test Agilent
 - Introduzione al nuovo ricevitore EMI Full Compliance Agilent MXE
 - Uso degli analizzatori Agilent della Serie-X per misure EMI pre-compliance.
 - Sorgenti per i test di immunità
 - Software applicativo

